



Технический семинар Проектирование и разработка систем автоматизированных испытаний и КПА: от тестеров ЭКБ до имитации внешней среды радиоэлектронных систем

19 сентября 2017 г.

Начало регистрации в 9-30.

Гостиница Рэдиссон Славянская, г. Москва, пл. Европы, д. 2

Уважаемые коллеги!

Компания National Instruments приглашает Вас принять участие в техническом семинаре, посвященном применению технологий модульных приборов для построения автоматизированных систем тестирования и контрольно-поверочной аппаратуры.

Постоянное усложнение продукции современной радиоэлектронной отрасли выдвигает все более сложные требования к тестированию радиоэлектроники, от входного контроля компонентной базы и параметрического тестирования отдельных блоков до сложного функционального тестирования комплексных систем в условиях, максимально приближенным к реальным. С другой стороны, ставятся все более сжатые временные рамки, как для тестирования, так и для разработки систем тестирования.

Для решения этих задач сегодня необходимо использовать современные подходы, позволяющие не только создать систему, наилучшим образом решающую текущую задачу, но и готовую к обновлению и модификации по мере изменения продукции и требований.

В ходе семинара специалисты National Instruments расскажут о лучших практиках построения систем параметрического и функционального тестирования и новинках программных и аппаратных средств, а партнеры и заказчики поделятся своим опытом реализации сложных комплексных проектов с помощью технологий и продуктов National Instruments. Будут рассмотрены такие задачи, как создание стендов тестирования и КПА для блоков и систем различной направленности, входной и выходной контроль ЭКБ, а также интеллектуальное тестирование сложных систем с помощью полунатурного моделирования и программно-аппаратной имитации подсистем.

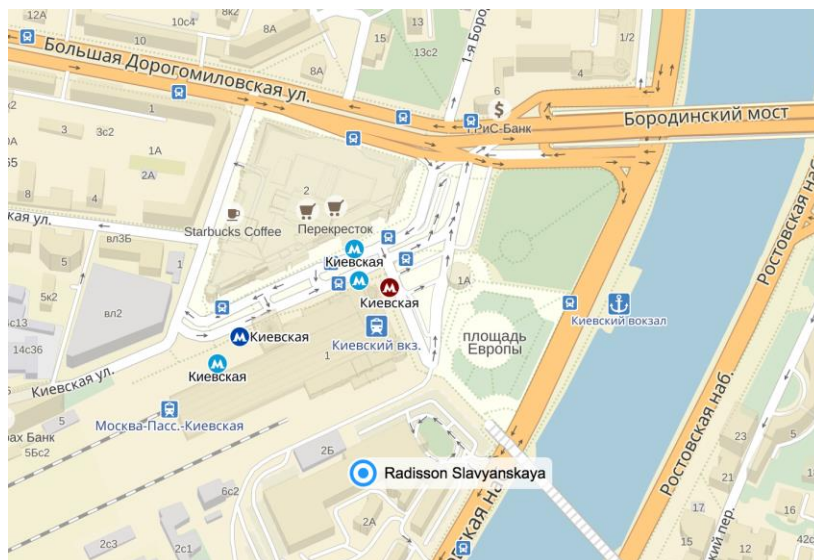
Подробная программа семинара представлена на следующей странице.

Участие в мероприятии бесплатное, по предварительной регистрации.

Будем рады видеть Вас и Ваших коллег!

Контакты: Евгения Кургузова Тел.: +7 (495) 783-68-51 Факс: +7 (495) 783-68-52 e-mail: evgenia.kurguzova@ni.com

г. Москва, площадь Европы, д.2, гостиница "Рэдиссон Славянская"



19 сентября 2017

Создание систем автоматизированного тестирования, КПА и тестеров ЭКБ

| | |
|-------|---|
| 10-00 | О компании National Instruments и ее инженерных ресурсах в России и СНГ |
| 10-15 | Построение автоматизированных систем тестирования и КПА на основе модульных приборов <ul style="list-style-type: none"> • Типовые архитектуры систем тестирования для комплексного тестирования современной радиотехники; • Модульные приборы PXI: Обзор линейки, новинки; • Системы коммутации сигналов; • Измерительные оснастки и системы быстрого подключения; • Новые киловаттные программируемые источники питания; • Интеграция больших систем, обеспечение целостности систем с помощью ATE Core Configurations; • NI TestStand: Специальные программные решения для высокопроизводительного тестирования; • Опыт построения собственных систем тестирования на базе NI PXI; • Сертификация и калибровка приборов и измерительных комплексов. |
| 11-00 | Тестирование компонентов, узлов и агрегатов с помощью программно-аппаратного моделирования (HIL) <ul style="list-style-type: none"> • Использование модельного подхода для функционального тестирования в реальном времени; • Применение ПЛИС в программно-аппаратном моделировании; • Измерительное оборудование с ОС жесткого реального времени и быстродействующими ПЛИС; • Инструменты графической разработки алгоритмов для ОС Реального Времени и ПЛИС. |
| 11-45 | Отработочные комплексы для функционального тестирования сложных и интеллектуальных радиотехнических систем <ul style="list-style-type: none"> • Архитектура программно-аппаратного моделирования систем HIL – для радиоэлектронных систем; • Имитация подсистем при автономных отработочных испытаниях; • Отработочные комплексы для тестирования узлов радарных систем в реальном времени; • Отработочные комплексы для тестирования узлов систем космической и наземной связи; |
| 12-30 | Обед |
| 13-15 | Тестирование ЭКБ: Входной контроль, сертификационные испытания <ul style="list-style-type: none"> • Современные подходы к разработке систем тестирования электронных компонентов; • Создание испытательных лабораторий по тестированию ЭКБ; • Этапы разработки тестового решения и требуемые ресурсы; • Тестирование ЭКБ на стойкость к воздействию спецфакторов; • Тестеры ЭКБ на базе PXI: архитектура, составные части, особенности реализации; • Бюджетные тестеры ЭКБ. |
| 14-00 | Система производственного тестирования ЭКБ – NI STS <ul style="list-style-type: none"> • Назначение и архитектура платформы NI STS; • Измерительная подсистема – варианты исполнения для аналого-цифровых и СВЧ микросхем; • Базовая плата и оснастки для монтажа микросхем, подключение плат оснасток к тестеру; • Тестовое ПО; • Стыковка с зондовыми автоматами и климатическими камерами; • Использование NI STS в задачах тестирования аналоговой, цифровой электроники, МЭМС датчиков; |
| 15-00 | Вопросы и ответы |

Регистрация осуществляется на странице russia.ni.com/events/

Контакты:

Евгения Кургузова

Тел.: +7 (495) 783-68-51

Факс: +7 (495) 783-68-52

e-mail: evgenia.kurguzova@ni.com.

г. Москва, площадь Европы, д.2, гостиница "Рэдиссон Славянская"

Ждём Вас!